

2017年7月28日

ZEP有機薄膜試料（下地金属薄膜なし）のTOF-SIMS分析

ラウンドロビン・テスト測定方法仕様書

本仕様は当協会の指定する試料の測定に関し、本仕様を満たす測定を実施できる分析機関を公募するに際して適用するものです。本測定実施を希望する機関はA項に示す期限までに当協会担当者に連絡をお願いします。今回の公募はラウンドロビン・テストですので、複数の分析機関の応募をお願いするものです。

測定仕様

(1)取得するもの

1. 正イオンマススペクトル
2. 負イオンマススペクトル
3. 正イオンマッピング画像
4. 負イオンマッピング画像

* TOF-SIMS に関する分析条件として帯電中和のあり/なしの測定以外は指定しません。代わりに分析条件を報告していただきます。

(2) 協会の指定する試料：ARC 有機薄膜試料

ZEP 有機薄膜試料（下地金属薄膜なし） 膜厚 20nm、50nm、100nm

(3)報告事項

- ・測定実施日、測定装置名
- ・1次イオン種、加速電圧、照射電流、パルス幅
- ・測定領域、ピクセル数
- ・測定時間
- ・測定質量範囲
- ・帯電中和の有無
- ・ARC由来のピーク強度比較

A. 希望納期

2017年9月25日

B. 分析に係る費用は上限額 150,000 円（消費税を含む）とします。

C. 応募期限

2017年8月4日（金）17:00 までに下記までに見積書とともに連絡をお願いします。但し、参加予定枠を設定しておりますので、予定枠に達した時点で締め切りとします。

担当：一般社団法人 研究産業・産業技術振興協会 調査研究部 嵩 比呂志

連絡先：東京都文京区本郷 3-23-1 クロセビア本郷ビル2F

TEL 03-3868-0826、E-mail suu@jria.or.jp

以上

2017年7月28日

ZEP有機薄膜試料（下地金属薄膜あり）のTOF-SIMS分析

ラウンドロビン・テスト測定方法仕様書

本仕様は当協会の指定する試料の測定に関し、本仕様を満たす測定を実施できる分析機関を公募するに際して適用するものです。本測定実施を希望する機関はA項に示す期限までに当協会担当者に連絡をお願いいたします。今回の公募はラウンドロビン・テストですので、複数の分析機関の応募をお願いするものです。

測定仕様

(1)取得するもの

1. 正イオンマススペクトル
2. 負イオンマススペクトル
3. 正イオンマッピング画像
4. 負イオンマッピング画像

* TOF-SIMS に関する分析条件として帯電中和のあり/なしの測定以外は指定しません。代わりに分析条件を報告していただきます。

(2) 協会の指定する試料：ARC 有機薄膜試料

ZEP 有機薄膜試料（下地金属薄膜あり） 膜厚 20nm、50nm、100nm

(3)報告事項

- ・測定実施日、測定装置名
- ・1次イオン種、加速電圧、照射電流、パルス幅
- ・測定領域、ピクセル数
- ・測定時間
- ・測定質量範囲
- ・帯電中和の有無
- ・ARC由来のピーク強度比較

A. 希望納期

2017年9月25日

B. 分析に係る費用は上限額 150,000 円（消費税を含む）とします。

C. 応募期限

2017年8月4日（金）17:00 までに下記までに見積書とともに連絡をお願いします。但し、参加予定枠を設定しておりますので、予定枠に達した時点で締め切りとします。

担当：一般社団法人 研究産業・産業技術振興協会 調査研究部 嵩 比呂志

連絡先：東京都文京区本郷 3-23-1 クロセビア本郷ビル2F

TEL 03-3868-0826、E-mail suu@jria.or.jp

以上

協会の指定する試料の例示

(1) ZEP 有機薄膜試料 (下地金属薄膜なし)



ZEP 有機薄膜試料 (下地金属薄膜あり)



